



ハイテクの一步先に、いつも。

# HORIBA

Explore the future

## 化合物半導体・有機EL・CNT向け評価・分析装置

### 顕微レーザーラマン測定装置 / フォトルミネッセンス測定装置

#### LabRAMシリーズ

- 励起レーザー: 244nm, 266nm, 325nm(紫外)、可視光~近赤外
- 測定レンジ: 200nm(紫外)~1600nm(近赤外)
- 波長分解能: 0.012nm/ピクセル
- 空間分解能: 1 $\mu$ m
- クライオスタット搭載可能



#### 分光エリプソメータ

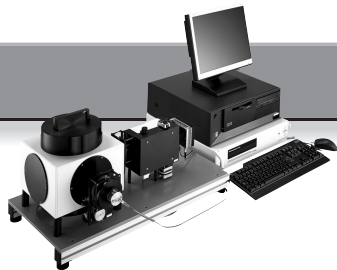
#### UVISEL シリーズ

- LD、LEDなどの多層膜構造の評価可能
- 1nmの極薄膜の膜厚評価が可能
- ガラスなどの透明基板にも対応
- 波長範囲: 190nm~2100nm
- 電動XYステージ搭載可能

### カソードルミネッセンス測定システム

#### MPシリーズ

- 化合物半導体や白色LEDの蛍光体の微小領域での物性評価・発光特性評価
- 波長分解能: 0.06nm
- 空間分解能: 100nm
- 光ファイバを採用したコンパクトタイプもあり



#### 蛍光寿命測定装置

#### FluoroCube

- 時間相関単一光子計数方式: TCSPCモード
- 寿命測定範囲: 20ピコ秒~数秒
- 寿命解析: 5成分解析可能
- 検出波長範囲: 185nm~650nm/850nm

### 迅速深さ方向元素分析装置

高周波グロー放電発光表面分析装置

#### GD-Profiler2

- 測定元素: H~U
- 測定深度: 数nm~100 $\mu$ m
- 測定濃度: 数10ppm~100%



■ 本製品の詳しい情報は → <http://www.horiba.com/jp/scientific>

株式会社堀場製作所

本社 〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2 TEL(075)313-8121

● 東京 (03) 3861-8231 ● 横浜 (045) 451-2091 ● 名古屋 (052) 936-5781 ● 大阪 (06) 6390-8011

● 仙台 (022) 308-7890 ● つくば (0298) 56-0521

● 広島 (082) 288-4433 ● 福岡 (092) 472-5041

科学システム営業部 03-3861-8234

<http://www.horiba.co.jp> e-mail: [info@horiba.co.jp](mailto:info@horiba.co.jp)